

分析機器部門講習会シリーズ

Nikon 超解像システムのデモ

光学顕微鏡の分解能は理論的に 200 nm が限界ですが、近年はいくつかの超解像顕微鏡観察法が発明されています。今回は、共焦点顕微鏡でピンホールを絞るとともにデコンボリューションによって分解能 160 – 170 nm 程度の観察ができる、いわゆる「疑似超解像」システムのデモを行います。

このシステムは、操作性が共焦点顕微鏡とほとんど変わらないことが特徴です。撮像には高感度ディテクターが必要なため、今回使用する分析機器部門の共焦点顕微鏡では超解像画像が撮れるのは2色までになりますが、ぜひお試しください。

日 時 :		10:00 – 12:00
	平成 27 年 12 月 17 日 (木)	13:00 – 15:00
		15:10 – 17:10

使用機器 : TiE-A1R, NIS-Elements C-ER (Nikon)

場 所 : 医系研究棟 3 号館 4 階 共焦点顕微鏡室 2

定 員 : 各回 1 組

申込期間 : 12 月 15 日 (火) 17 時まで

申込方法 : メールで、「氏名」「所属講座」「内線番号」「メールアドレス」「希望時間」「持参サンプルの有無」を明記の上、件名を「Nikon 超解像デモ」として e.yorifuji@med.nagoya-u.ac.jp 宛にお申し込みください。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当: 依藤 絵里 (内線: 5792、E-mail: e.yorifuji@med.nagoya-u.ac.jp)

※Web でも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)